

内蒙古豪安能源科技有限公司 NEIMENGGU HAOAN ENERGY TECH CO., LTD

P型S单晶硅片规格标准

 文件编号
 NMHA-ZD-FQC-P10

 页
 次
 第 1 页 共 4 页

 文件版本
 A/3

0.1 封面

序号	版本	修订内容	生效日期	备注
1	A/0	首次发行	2019/03/12	
2	A/1	更新	2020/03/12	
3	A/2	更新	2020/06/01	
4	A/3	更新 M10/G12 标准	2020/09/15	

批准	审核	制定
日期	日期	日期



内蒙古豪安能源科技有限公司 NEIMENGGU HAOAN ENERGY TECH CO., LTD

P型S单晶硅片规格标准

文件编号	NMHA-ZD-FQC-P10
页 次	第2页共4页
文件版本	A/3

1 适用范围 Applicability

本标准规定了 P 型单晶硅片的电性能、外观尺寸、外观质量技术要求、标志、包装、存储等规定。

本标准适用于 P 型 158.75mm×158.75mm、166mm×166mm、182mm×182mm 及 210mm×210mm 太阳能级 S 单晶硅片的检验。

2 术语 Terms

硅片厚度: 硅片中心点厚度为硅片的标称厚度。

总厚度变化(TTV:Total Thickness Variation): 硅片的厚度最大值与最小值之差,称作硅片的总厚度变化。 弯曲度: 硅片中心面偏离基准平面的距离,该距离表示硅片的弯曲度。

崩边(硅落/硅脱): 硅片边缘呈现的单面局部破损称为崩边,也称为硅落,硅脱。

缺口: 硅片边缘呈现贯穿两面的局部破损称为缺口。

裂纹: 硅片内部存在的细小的裂缝。

锯痕: 硅片在切割过程中产生的切割痕迹, 称为锯痕, 又称为线痕。

沾污: 硅片表面上肉眼裸视可见的各种外来异物的统称。

孔洞: 贯穿硅片两面的无规则、大小不等的小孔。

翘曲: 硅片表面扭曲的形变量与中心轴之间的差值(可以理解为局部正弦波波峰与波谷的距离)。

亮线: 硅片表面锯痕深度小于 15μm, 肉眼可分辨其亮度明显高于正常硅片表面颜色的条状物或块状物。

划伤: 硅片表面锯痕深度小于 15μm, 肉眼可分辨其亮度明显高于正常硅片表面颜色的片状物。



内蒙古豪安能源科技有限公司 NEIMENGGU HAOAN ENERGY TECH CO., LTD

P型S单晶硅片规格标准

 文件编号
 NMHA-ZD-FQC-P10

 页
 次
 第 3 页 共 4 页

 文件版本
 A/3

品名	D Title 2			um I.	
金刚线切割硅片	P型S単晶硅片规格书			版本 	A/3
Properties 内容	Parameters 参数				
1. Electric & Chemica	1 电性能及化学	性能			
项目		规格		检测方法或依据	
Dopant 掺杂剂	Gallium			ASTM F42	
Dislocation Density 位错密度	≤500/cm²			金相显微镜	
Carbon Concentration 碳含量	Max 5.0E16 atoms/cm³			FIRT(红外探测)	
Oxygen Concentration 氧含量	Max 8	8.0E17 atoms/cm³		FIRT(红外探测)	
Resistivity 电阻率	0.4-1.1Ω.cm		硅检机		
Conductivity type 导电类型	P 型			P/N 测试仪	
Crystal Orientation 晶向	(100) ±3°			X射线定向仪器	
Life time (Brick level) 少子寿命	≥75us		Sinton 少子寿命测试仪		
Crystal imperfection 晶体缺陷	孔洞、应力、孪晶、黑心、同心圆、黑角等 不允许		硅片分选机/PL 测试仪		
LID 光致衰減	≤ 1.5%		5KWH/ <mark>m²</mark>		
2. Geometrical Propert	ies 规格类型				
项目	G1	M6	M10	G12	测试方法
边长(mm)	158.75 ± 0.25	166 ± 0.25	182 ± 0.25	210 ± 0.25	硅检机
直径(mm)	223 ± 0.25	223 ± 0.25	247 ± 0.25	295 ± 0.25	硅检机
圆弧长度(mm)	1.5±0.5	12.0 ± 0.5	10.62 ± 0.5	2.0 ± 0.5	硅检机
弦长投影(mm)	1.07 ± 0.5	8.55±0.5	7.51 ± 0.5	1.41±0.5	硅检机
倒角偏差 (mm)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	硅检机
垂直度(°)	90° ±0.2	90° ±0.2	90° ±0.2	90° ±0.2	硅检机



内蒙古豪安能源科技有限公司

NEIMENGGU HAOAN ENERGY TECH CO., LTD

 文件编号
 NMHA-ZD-FQC-P10

 页
 次
 第4页共4页

P型S单晶硅片规格标准

文件版本 A/3

3. Geometrical Properties 外观特性				
项目	规格	测试方法		
Thickness (T) 中心厚度	160+20/-10 Average> 160	硅检机		
TTV 总厚度变化	<mark>≤27um</mark>	硅检机		
Bow & Warping 弯曲 & 翘曲度	≤40um	硅检机		
Saw marks 线痕	深度 (単位: μm) ≤13	硅检机		
程晶脱落、缺口、孪晶、 裂纹、沾污、针孔 [surface chips, edge breakage (indents), twin crystal, crack, stain, pinhole]	不允许	Naked eyes 目测 硅检机		
Indentation 崩边	长 ≤0.5 mm, 深 ≤0.3 mm, 每片 不能超过 2 个, 无有 V 型崩边	Naked eyes 目测 硅检机		
Surface quality 表面质量	Cleaned, no grease stains 表面洁净,没有 油污	Naked eyes 目测 硅检机		
Package 包装	600pcs/package 600 片/盒	每 100 片用硫酸纸及隔板隔开		
Labels 标识	Neutralor Customer requirements 中性或客户指定			